

検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉 (メモリハイロガー〈MEMORY HILOGGER〉)
 形名〈Model Number〉 (LR8400)
 製造番号〈Serial No.〉 (No. 181112345)
 検査年月日〈Test Date〉 (2018-11-06)
 (〈YYYY-MM-DD〉)
 検査条件〈Test Conditions〉 (23.4 °C, 62 %rh)

項目 〈Item〉	結果 〈Result〉
1. セルフチェック〈Self Check〉	
-1.ROM,RAMチェック〈ROM,RAM Check〉	(PASS)
-2.キー、開始LED、ブザーチェック〈Keyboard, Start LED, Buzzer Check〉	(PASS)
-3.LCDチェック〈LCD Check〉	(PASS)
-4.バックライトチェック〈Back Light Check〉	(PASS)
2. 機能〈Function〉	
-1.トリガ出力〈TRIG OUT〉	(PASS)
-2.外部トリガ〈EXT TRIG〉	(PASS)
-3.12V出力〈12V Power Output〉	(PASS)
-4.時計のバックアップ〈Backup Of The Clock〉	(PASS)
-5.CFカード、USBメモリ〈CF Card, USB Memory〉	(PASS)
-6.ファイル保護チェック〈File Protection〉	(PASS)
-7.波形バックアップ〈Backup Of The Wave〉	(PASS)
-8.電源LED、電源表示チェック〈Power LED, Power Supply Indication Check〉	(PASS)
-9.充電動作チェック〈Battery Charge〉	(PASS)
-10.LAN動作チェック〈LAN Interface Check〉	(PASS)
-11.USB動作チェック〈USB Interface Check〉	(PASS)
-12.シングルエンド動作チェック〈Single End Check〉	(PASS)
-13.断線検出〈Burn Out〉	(PASS)
-14.パルス入力〈Pulse〉	(PASS)
-15.ロジック〈Logic〉	(PASS)
-16.警報出力〈Alarm Output〉	(PASS)
3. ユニット接続	
-1.ユニット識別信号チェック 〈Unit Discrimination Check〉	(PASS)
-2.スキャン信号チェック 〈Scanning Signal Check〉	(PASS)
-3.定電流印加ラインチェック 〈Constant Current Check〉	(PASS)
4. セットアップ〈Setup〉	
5. 時間軸確度〈Time Base Accuracy〉	
内部クロック周波数 〈Internal Clock Frequency〉	許容範囲 〈Tolerance〉
32.768 kHz	32.767925 kHz ~ 32.768075 kHz
	校正値 *1 〈Calibration Value〉
	(32.767987 kHz)

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected By〉	承認者〈Approved By〉
(PASS)	()	()

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

製造番号<Serial No.> (No. 181112345)
 検査年月日<Test Date> (2018-11-06)
 <YYYY-MM-DD>

6. 測定確度

-1. 熱電対<TC>

チャンネル <CH>	熱電対 *1<TC>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
CH1	K	100 °Cf.s.	4.096 mV	99.40 °C ~ 100.60 °C	(100.00 °C)
	K	500 °Cf.s.	20.644 mV	499.40 °C ~ 500.60 °C	(500.00 °C)
	K	2000 °Cf.s.	54.138 mV	1349.2 °C ~ 1350.8 °C	(1349.9 °C)
	J	100 °Cf.s.	5.269 mV	99.40 °C ~ 100.60 °C	(100.00 °C)
	E	100 °Cf.s.	6.319 mV	99.40 °C ~ 100.60 °C	(99.99 °C)
	R	100 °Cf.s.	0.647 mV	95.50 °C ~ 104.50 °C	(99.98 °C)
	R	500 °Cf.s.	4.471 mV	497.80 °C ~ 502.20 °C	(499.95 °C)
	R	2000 °Cf.s.	20.222 mV	1697.8 °C ~ 1702.2 °C	(1699.9 °C)
	W	100 °Cf.s.	1.451 mV	98.20 °C ~ 101.80 °C	(99.99 °C)
	W	500 °Cf.s.	8.657 mV	498.20 °C ~ 501.80 °C	(500.00 °C)

*1. 基準接点補償を行わない。

<Reference junction compensation is not conducted.>

-2. 電圧<Voltage>

チャンネル <CH>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
CH1	10 mVf.s.	-10 mV	-10.0100 mV ~ -9.9900 mV	(-9.9980 mV)
		0 mV	-0.0100 mV ~ 0.0100 mV	(0.0010 mV)
		10 mV	9.9900 mV ~ 10.0100 mV	(9.9985 mV)
	20 mVf.s.	-20 mV	-20.020 mV ~ -19.980 mV	(-19.998 mV)
		0 mV	-0.020 mV ~ 0.020 mV	(0.001 mV)
		20 mV	19.980 mV ~ 20.020 mV	(19.998 mV)
	100 mVf.s.	-100 mV	-100.100 mV ~ -99.900 mV	(-99.985 mV)
		0 mV	-0.100 mV ~ 0.100 mV	(0.005 mV)
		100 mV	99.900 mV ~ 100.100 mV	(99.985 mV)
	200 mVf.s.	-200 mV	-200.20 mV ~ -199.80 mV	(-199.96 mV)
		0 mV	-0.20 mV ~ 0.20 mV	(0.01 mV)
		200 mV	199.80 mV ~ 200.20 mV	(199.96 mV)
	1 Vf.s.	-1 V	-1.00100 V ~ -0.99900 V	(-0.99985 V)
		0 V	-0.00100 V ~ 0.00100 V	(0.00005 V)
		1 V	0.99900 V ~ 1.00100 V	(0.99990 V)
	2 Vf.s.	-2 V	-2.0020 V ~ -1.9980 V	(-1.9996 V)
		0 V	-0.0020 V ~ 0.0020 V	(0.0001 V)
		2 V	1.9980 V ~ 2.0020 V	(1.9996 V)
	10 Vf.s.	-10 V	-10.0100 V ~ -9.9900 V	(-9.9985 V)
		0 V	-0.0100 V ~ 0.0100 V	(0.0005 V)
		10 V	9.9900 V ~ 10.0100 V	(9.9980 V)
	20 Vf.s.	-20 V	-20.020 V ~ -19.980 V	(-19.998 V)
		0 V	-0.020 V ~ 0.020 V	(0.001 V)
		20 V	19.980 V ~ 20.020 V	(19.998 V)
100 Vf.s.	-100 V	-100.100 V ~ -99.900 V	(-99.980 V)	
	0 V	-0.100 V ~ 0.100 V	(0.005 V)	
	100 V	99.900 V ~ 100.100 V	(99.980 V)	

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

製造番号<Serial No.> (No. 181112345)
 検査年月日<Test Date> (2018-11-06)
 <YYYY-MM-DD>

6. 測定精度

-3. 測温抵抗体<PT> *3

チャンネル <CH>	レンジ <Range>	接続 <Wire>	入力 *2<Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
CH1	100 °Cf.s.	3W	138.51 Ω	99.40 °C ~ 100.60 °C	(100.00 °C)
	500 °Cf.s.		280.98 Ω	499.20 °C ~ 500.80 °C	(499.95 °C)
	2000 °Cf.s.		375.70 Ω	799.0 °C ~ 801.0 °C	(799.9 °C)
	100 °Cf.s.	4W	138.51 Ω	99.40 °C ~ 100.60 °C	(100.00 °C)
	500 °Cf.s.		280.98 Ω	499.20 °C ~ 500.80 °C	(500.00 °C)
	2000 °Cf.s.		375.70 Ω	799.0 °C ~ 801.0 °C	(800.0 °C)

*2. 抵抗体: Pt100<Resistance : Pt100>

-4. 抵抗<Resistance> *3

チャンネル <CH>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
CH1	10 Ω f.s.	10 Ω	9.9900 Ω ~ 10.0100 Ω	(10.0020 Ω)
	20 Ω f.s.	20 Ω	19.980 Ω ~ 20.020 Ω	(20.003 Ω)
	100 Ω f.s.	100 Ω	99.900 Ω ~ 100.100 Ω	(99.990 Ω)
	200 Ω f.s.	200 Ω	199.80 Ω ~ 200.20 Ω	(199.98 Ω)

*3. LR8400でもユニバーサルユニット増設時のために検査しています。

<In case for adding a Universal Unit, LR8400 is also inspected.>

-5. 基準接点補償精度<RJC>

ユニット/チャンネル <Unit>/<CH>	レンジ <Range>	熱電対 <TC>	入力 *4<Input>	許容範囲 <Tolerance>	校正値 *1 <Calibration Value>
Unit 1/CH8	100 °Cf.s.	K	(0.00 °C)	-0.50 °C ~ 0.50 °C	(0.19 °C)
Unit 2/CH8	100 °Cf.s.	K	(0.00 °C)	-0.50 °C ~ 0.50 °C	(0.15 °C)

*4. 基準接点補償を行う。(標準器校正値使用)

<Reference junction compensation is conducted. (Used as Standard Calibration Value.)>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

備考<Note>

下記製品は、検査成績表のポイントが共通であるため、代表して形名をLR8400と表記しています。

LR8400, LR8400-03, LR8400-20, LR8400-21, LR8400-23

<Because the inspection points of Models LR8400, LR8400-03, LR8400-20, LR8400-21 and LR8400-23 are the same, Model LR8400 is used in this data sheet to represent all three models.>

LR8400は1つの計測回路で測定しているため、ch1で代表して校正しています。

<Because Model LR8400 uses one measurement circuit to conduct measurements,

ch1 is used as the reference channel during calibration.>

ch2~30については、スキャン信号チェックおよび定電流印加ラインチェックにより、切替動作が正常であることを確認しています。

<The switching operation of ch2 to ch30 are confirmed by checking the Scanning Signal Check and the Constant Current Check.>

測定精度 熱電対は、回路構成が同じ熱電対、レンジの組み合わせがある場合は、代表して校正しています。

<Calibration of TC measurement has been done using one combination of thermal couple and input range as representative, if there is a few combinations of thermal couple and input range and all of them have same electrical circuit structure.>

時間軸精度については、製品仕様±0.2s/日(±2.31ppm)の確認を内部クロック周波数確認にて代用しています。

<Time Base Accuracy (±0.2s/day (±2.31ppm)) is confirmed by checking the Internal Clock Frequency.>

*1 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>